



- Interface de test sous vide avec cassette sous vide serrant en parallèle.
- Y compris interface adaptatrice pour système de test Keysight i3070
- Y compris poignées de transport compatibles Alum-A-Lift
- Version robuste, facile à entretenir, d'une longévité hors pair
- Confort d'utilisation accru, manipulation simple et intuitive
- Pour le montage des articles livrés non montés, les dessins des articles indiqués dans la liste de pièces doivent être utilisés.

Utilisation

Les interfaces de test sous vide (VA) sont utilisées pour mettre en contact, de façon sûre en processus, des cartes électroniques en grands nombres et comptant peu de variantes.

Version

- Plaque porte-contacts en FR4 invariable épais de 14 mm
- Plaque d'applique en FR3 épais de 8 mm, avec surface conductrice ESD
- Joint de vide INGUN confirmé longue durée, à faible usure
- Y compris poignées de transport compatibles Alum-A-Lift pour un transport confortable
- Pièces de cadre latérales avec ébréchure programmée et couvercle en plastique, pour le montage de compte-courses disponibles en option
- Verrouillages disponibles en option pour sécuriser la plaque d'applique

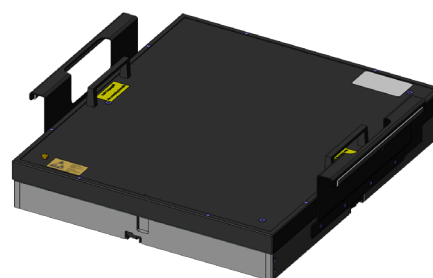
Livraison

La livraison a lieu non montée. Cela permet un traitement immédiat spécifique pour l'objet à tester. Pour le montage des articles livrés non montés, les dessins des articles indiqués dans la liste de pièces doivent être utilisés.

Données générales

Interface pour système de test:	Keysight i3070 petit
Groupe de produits:	Interface de test sous vide (VA)
Série principale:	VA xxxx
Sous-série:	VA 30xx
Série:	VA 3070S
Taille du type:	xx70S
Type d'interface de test:	Interface individuelle, Keysight petit
Génération de course de contact:	vide
Type de boîtier:	Boîtier plat
Signaux d'interface max.:	0
Blocs d'interface requis:	non
Blocs d'interface internes max.:	0
Sens de mise en contact:	ICT en bas
Force de contact max.:	13.000 N
Course de contact parallèle env.:	7 mm
Poids:	19,4 kg
Température min.:	10 °C
Température max.:	60 °C
Basse tension:	non
Conformité ESD:	non
Conforme RoHS:	oui

NEW



INGUN SELECTION

Remarque :

Pour l'équipement professionnel de l'interface de test sous vide VA 3070, le schéma d'équipement INFO 4677 est utilisé, et la consigne d'équipement INFO 4675 pour tenir compte de zones barrées d'accès (Keepouts).

Remarque :

Les positions dans les zones L004/L008:S11/S30 et L232/L236:S49/S68 ne peuvent pas, en raison de l'exécution des canaux d'aspiration, être garnies de broches de transmission.

Caractéristiques techniques

Hauteur d'incorporation pointe de test en bas:	16 mm
Version standard:	oui
Surface utile standard (LxP):	315 x 400 mm
Version ESD:	non
Version haute fréquence:	non
Version à aiguille rigide:	non
Version à 2 niveaux:	non
Mise en contact en haut (ZSK):	oui, avec option supplémentaire adaptée
Dimensions hors tout fermé (LxPxH):	473 x 460 x 117 mm

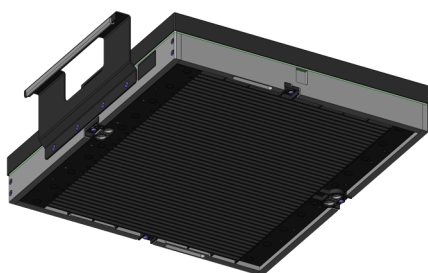
Vacuum test fixture

VA 3070S/i3070

Article 114853



ingun[®]
Partner for Future Technology



Accessories

Part no.	Designation	Version	Compatible with
115385	FB-VER-ADP-VA3070	Locking unit moving plate	VA 3070 versions without top unit
45000	PP-INGUN-F	Personality pin	VA 3070S/ST/L/LT versions
116613	EHZ-08-R-11-TR	Electric stroke counter	VA 3070S/ST/L/LT versions
11224	EHZ-08-R-49-OM	Electric stroke counter	VA 3070S/ST/L/LT versions
34865	EHZ-08-R-32-HE	Electric stroke counter	VA 3070S/ST/L/LT versions
1571	FED-10,0-16,0-97N-09,0	Pressure spring	VA 3070 single-stage versions (ICT)
1581	FED-10,0-21,5-100N-09,7	Pressure spring	VA 3070 dual-stage versions (ICT/FCT)
2579	HBS-01,0-10,0	Stroke-limiting disk	VA 3070 single-stage versions (ICT)
11890	HBS-05,0-07,0	Stroke-limiting disk	VA 3070 dual-stage versions (ICT/FCT)

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Tarifs et délais de livraison sur demande.
Modifications techniques réservées. 11/25_FR

Informations avancées sur le thème
Kits d'interface de test

